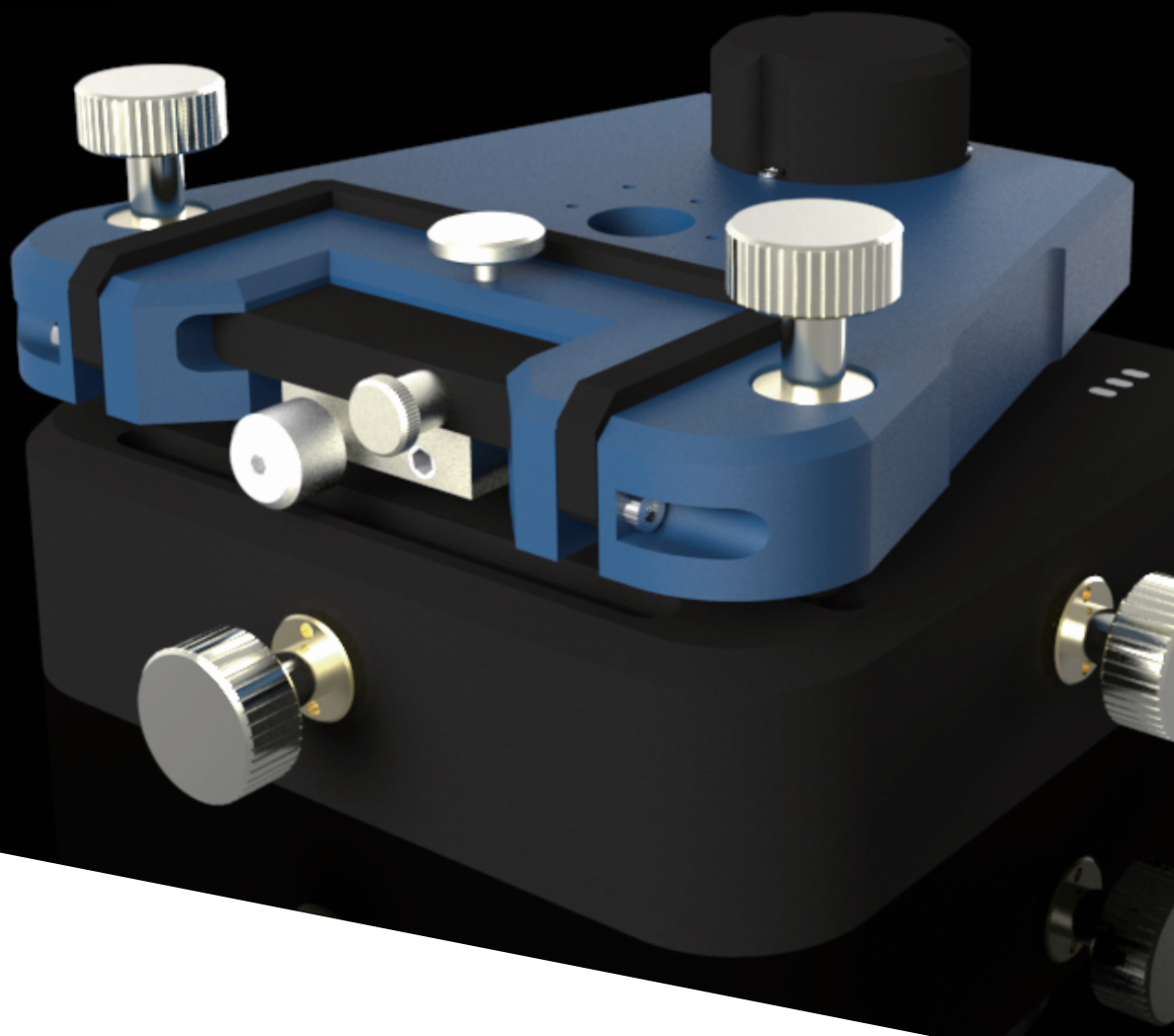


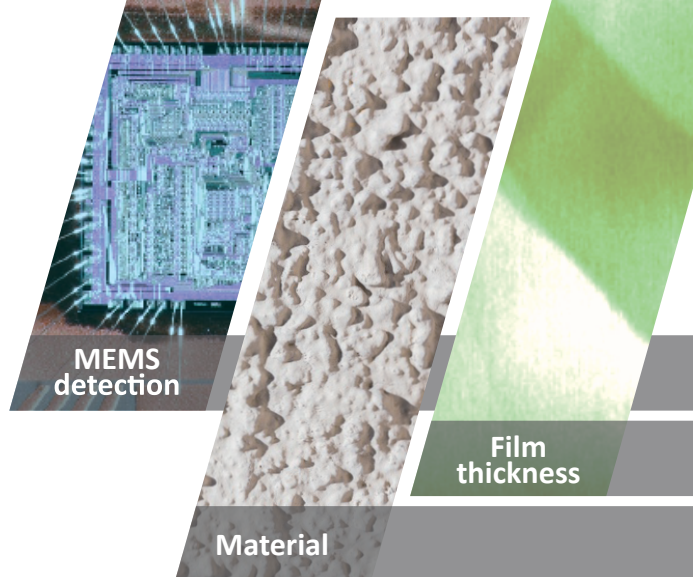
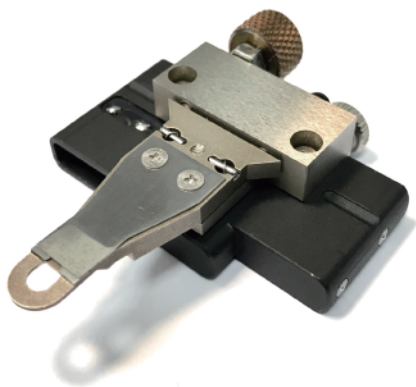
原子力顯微鏡

體積輕巧、品質可靠、高性價比、
最佳解決方案與專利設計

適合奈米教育與基礎科學研究

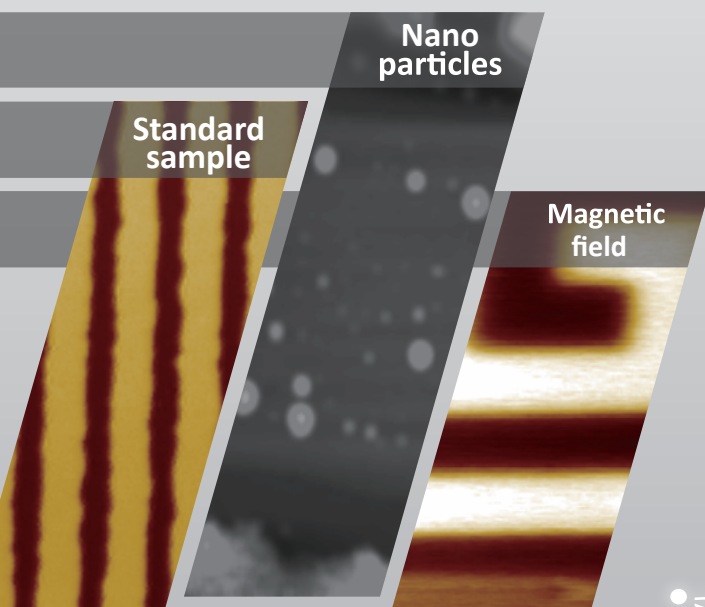
最高性價比的原子力顯微鏡

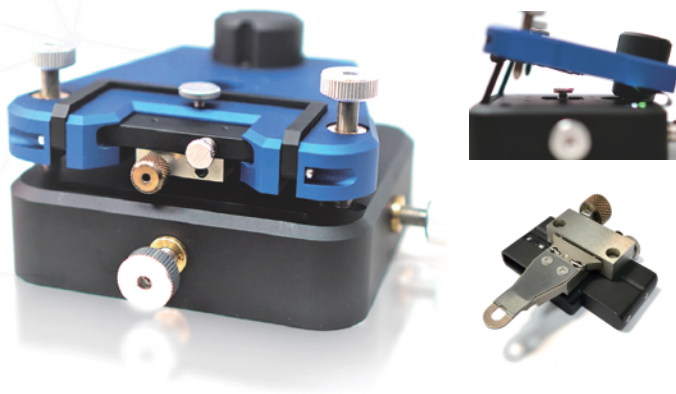




相同的影像解析度

一半的價格與五分之一的系統體積





Crabi-AFM-E-01

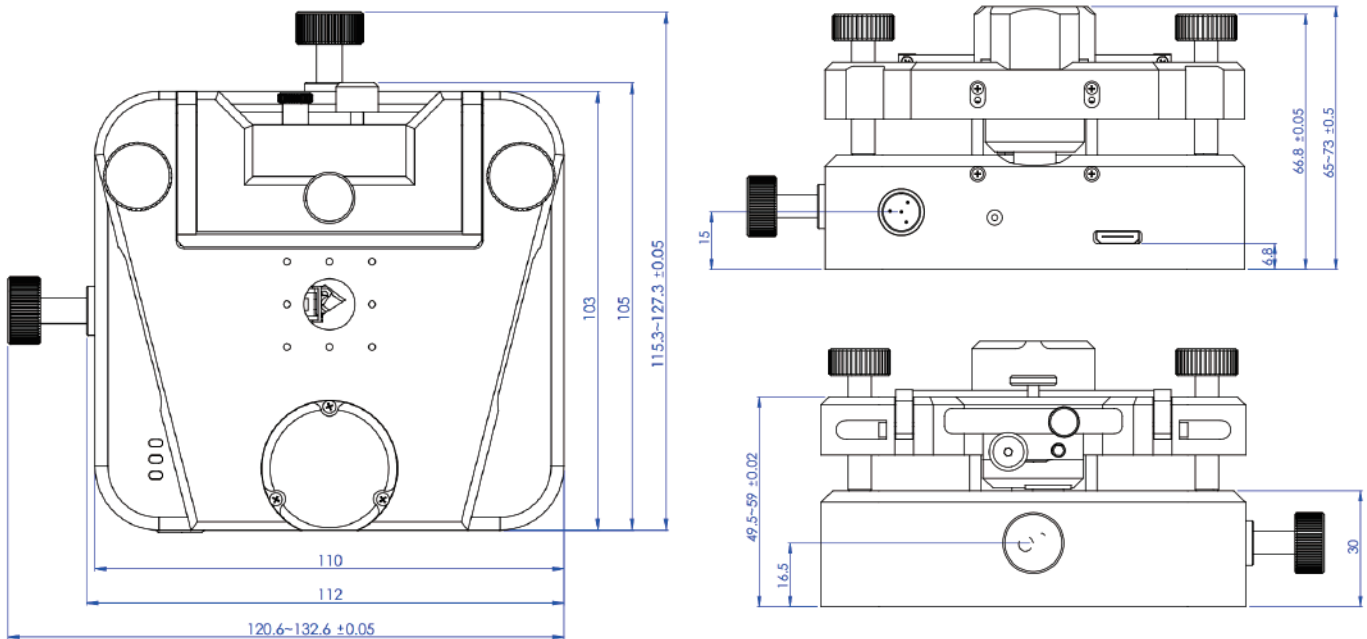
- ◆ 體積輕巧
- ◆ 品質可靠
- ◆ 高性價比
- ◆ 最佳方案
- ◆ 專利設計

● Crabi原子力顯微鏡系統專門設計為奈米教育、基礎科學研究與相關技術訓練使用。創新的核心專利技術能在最精巧的系統體積下提供可靠的影像結果。Crabi原子力顯微鏡將是滿足您需求的最佳解決方案。

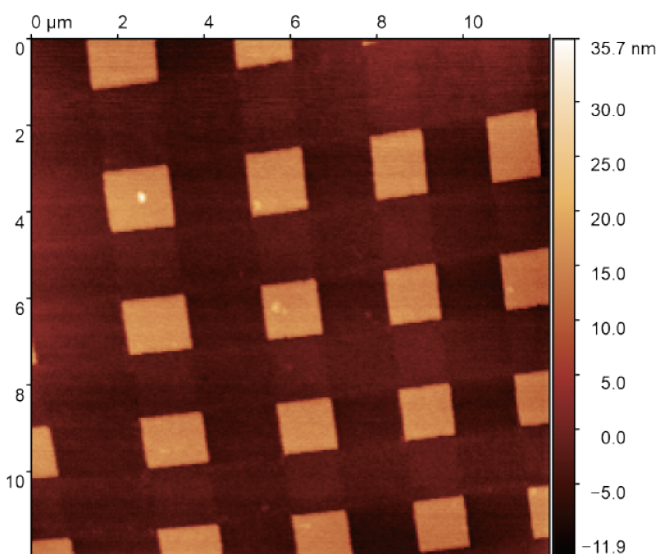
規格

功能	CrabiAFM-E-01	單位
DAC/ADC	12	bits
最大掃描範圍	10	μm
最大掃描高度	1.4	μm
XY解析度	2.5	nm
Z解析度	0.35	nm
掃描速度	>2	Hz
成像模式	AC mode, Amplitude error, Phase	--
頻譜模式	Force-distance	--
最大樣品長寬/高度	12/4	mm
最大樣品粗調範圍	12 in XY	mm
下針模式	Auto/ 6 mm	mm
上方光學影像	No	--
機構尺寸	110x110x67	mm
軟體功能差異		
設定掃圖區域角度	Yes	
由目前影像區域重新定義掃描區域	Yes	
影像顯示色彩調整	Yes	
* 核心專利技術已申請通過		

機構尺寸圖



參考解析影像



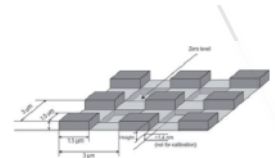
扫描参数

扫图范围: 12 by 12 micron

扫图速度: 1 Hz

探针频率: ~300 kHz

样品: Standard sample from NT-MDT - TGQ1



样品规格

Grating description

Structure	- Si wafer
Pattern types	3-Dimensional array of small rectangles
Period	3.0±0.05 μm
Height	20nm ±1.5 nm*
Rectangles side size:	1.5±0.35 μm
Chip size	5x5x0.5 mm
Effective area	central square 3x3 mm

影像分析建議

A free SPM (Scanning probe microscopy) image analyzer is recommended here: **Gwyddion**. It is a modular program for SPM data visualization and analysis. Primarily it is intended for the analysis of height fields obtained by scanning probe microscopy techniques (AFM, MFM, STM, SNOM/NSOM) and it supports a lot of SPM data formats. However, it can be used for general height field and (greyscale) image processing, for instance for the analysis of profilometry data or thickness maps from imaging spectrophotometry.

Refer from: <http://gwyddion.net/>